

施設・設備利用の手引き

目次

1. 施設・設備利用の実施について	2
2. 機器利用手続きについて	2
3. 研究成果報告書について	3
4. 本研究による成果の発表について	3
5. 知的財産権の取扱いについて	3
6. 問い合わせ先.....	3

物質・デバイス領域共同研究拠点

国立大学法人九州大学先導物質化学研究所

1. 施設・設備利用の実施について

- 施設・設備利用をする際は、事前に利用機器管理地区の研究支援室または装置担当者と打ち合わせの上、実施願います。
- 共用機器の利用は、原則として測定件数の上限を設けさせていただきます。詳細については、「**(別紙 1) 施設利用ポイント制**」を参照ください。
- 施設・設備利用期間中は、装置担当者の指示等に従い、所内の規則等を遵守願います。

2. 機器利用手続きについて

各種手続きにおいて必要な書類を期日までにメールまたは郵送にてご提出ください。書類は先導物質化学研究所 HP からダウンロードできます。

<https://www.cm.kyushu-u.ac.jp/joint/#guide>

◆ 研究支援室管理の機器（共用機器）を利用する場合

- 共用機器利用時間は、原則として 9 時～17 時（土日祝は利用不可）とします。
- 大学連携研究設備ネットワーク（以下「設備ネット」という）登録機器を利用する場合は、所属大学の担当者を通じて ID を取得するようお願いいたします。（※ 国立大学法人のみ）

※ 本研究所の共用機器、設備ネット登録機器については、先導物質化学研究所 HP を参照ください。<https://www.cm.kyushu-u.ac.jp/joint/#invitation>

※ 設備ネットの詳細については、HP を参照ください。

<https://chem-eqnet.ims.ac.jp/>

利用形態	利用手続き
依頼測定 （研究支援室に測定依頼する場合）	① 事前に機器管理地区の研究支援室に連絡 ↓（承認） ② 「測定依頼書」とサンプルを装置担当者に送付 （測定依頼書は装置担当者指定の様式でも可）
来所測定 （自己測定を行う場合）	① 利用機器管理地区の研究支援室または装置担当者に連絡（日程調整・測定の打ち合わせ） 来所日までに「来所届」を九州大学先導物質化学研究所拠点事務に提出 ↓（来所・測定後） ② 施設利用後、「共用機器利用報告書」を記入の上、利用機器管理地区の研究支援室または装置担当者に提出

◆ 各研究室所有の機器を利用する場合

利用機器を所有する研究室に直接ご連絡の上、ご利用ください。

3. 研究成果報告書について

期日までに「物質・デバイス領域共同研究拠点 研究成果報告書」を拠点公募システムにてご提出願います。

※ 提出期限：2026 年 3 月末予定（詳細は別途お知らせいたします）

4. 本研究による成果の発表について

本研究による成果を発表される場合は、「物質・デバイス領域共同研究拠点における共同研究による」旨の文章を明記して下さい。

（英文例）This work was performed under the Cooperative Research Program of "Network Joint Research Center for Materials and Devices".

5. 知的財産権の取扱いについて

知的財産が創作されたときは、速やかに所属機関の間で知的財産権の帰属について協議をしてください。ただし、原則として各機関の権利の持ち分は各研究者の発明等に対する貢献度によるものとします。

6. 問い合わせ先

施設・設備利用についてご不明な点は下記までお問い合わせください。

◆ 施設・設備利用（全般）について

＜物質・デバイス領域共同研究拠点＞

九州大学先導物質化学研究所 拠点事務

〒816-8580 福岡県春日市春日公園 6-1

TEL/FAX : 092-583-8898

Email : kyoten@cm.kyushu-u.ac.jp

◆ 先導物質化学研究所 各地区研究支援室のお問い合わせ先

筑紫地区研究支援室（本部）

TEL/FAX : 092-583-8898

Email : kyoten@cm.kyushu-u.ac.jp

伊都地区研究支援室（分室）

TEL : 092-802-6214

Email : ito-ac@cm.kyushu-u.ac.jp

「施設利用」ポイント制について

施設の利用に関して下記の様な制限を設けさせて頂いています。

(※ 筑紫地区と伊都地区共用機器（依頼測定・一部来所自己測定）が対象です。)

1. 各利用者に年間利用ポイントとして **20 ポイント**を配分いたします。
2. 各施設、設備のご利用に際して、それぞれに応じた利用ポイント（資料1 参照）を減じます。
3. 年間利用ポイントが無くなりました時点で年度内利用（無料）は終了とさせていただきます。(※ 年間利用ポイントの残りが僅かになりましたら、お知らせいたします。)

尚、それ以降に施設（共用機器）の利用を希望される場合は、有料測定となりますので、その旨予めご了承ください。

本課題研究に関し共著論文または拠点への謝辞を記載頂いた論文を当該年度に発表の際には、次年度に年間利用ポイントを **5 ポイント追加配分**いたします。また、論文発表の際にはご一報下さいますようお願い致します。

各施設、設備の利用に要するポイント数（筑紫地区共用機器）

利用項目		ポイント数
設備名	測定の種類	依頼測定
NMR ECA600、ECZ400	1D (¹ H、 ¹³ C) 基本測定	2／測定
	2D 測定、1D 多核測定	1／時間
	長時間測定（5 時間毎）	2
	応用測定（NOE、DOSY）	4／件
固体 NMR ECA400	¹³ C、 ²⁹ Si、CPMAS、DDMAS	4／日
固体 NMR ECA800	²⁷ Al、 ¹¹ B、 ²³ Na、 ¹⁹ F 他多数 MQMAS、DQMAS	20／件 (1 日以内の測定)
二重収束質量分析装置（JMS-M700）	Low Mass	2／件
EI、FAB イオン化	Low Mass + High Mass	4／件
飛行時間型質量分析装置（JMS-T100CS）	Low Mass	2／件
ESI、Cold-spray イオン化	High Mass	3／件
マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析装置（JMS-S3000）		3／件 (1／件※)
超強力単結晶構造解析システム（リガク FR-E+）		5／件 (3／件※)
二波長線源型高分解能単結晶 X 線構造解析装置(リガク XtaLAB Synergy-R/DW)		
高分解能小角散乱装置（Bruker SAXS NANOSTAR）		
高輝度広角 X 線回折システム薄膜解析部（リガク TTR-III）		2／件 (1／件※)
高輝度広角 X 線回折システム熱量同時評価部（リガク SmartLab）		
デジタルマイクロスコープ（VHX-900F）		1／件
走査電子顕微鏡（JSM-IT700HR）		2／件
電子スピン共鳴装置（JES-FA200）		3／件 (1／件※)

※ 来所自己測定の場合

<利用の一例>

サンプル 1：		
NMR 測定	^1H ^{13}C (15 時間)	2 point + 6 point → 8 point
MS	High Mass	4 point
サンプル 2：		
粉末 X 線		2 point
NMR 測定	^1H + NOE	4 point
サンプル 3：		
NMR 測定	^{19}F	2 point
		<u>合計 20 point</u>

各施設、設備の利用に要するポイント数（伊都地区共用機器）

利用項目		ポイント数	
設備名	測定の種類	依頼測定	利用者による自己測定
NMR 600MHz (Bruker AVANCE III)	1D (^1H 、 ^{13}C) 基本測定	1／件	0.5／時間
	長時間測定（5 時間毎）	2	
	応用測定（NOE、DOSY）	4／件	
二重収束質量分析装置 (JMS-700 MStation)	Low Mass	1／件	※
	Low Mass + High Mass	3／件	※
マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析装置 (Bruker Autoflex)		※	0.5／時間
飛行時間型質量分析装置 (JEOL JMS-T100CS)		※	0.5／時間
NMR 400MHz (Bruker AVANCE III)		※	0.5／時間
GC-MS/TGA (パーキンエルマー Clarus 600)		※	1／件
電子スピン共鳴装置 (JEOL JES-TE300)		※	1／件
X 線光電子分光装置 (ULVAC-PHI APEX ESCA)		※	1／日
共焦点レーザー顕微鏡 (Carl Zeiss LS meta 510 confocal microscope)		※	1／時間
リサイクル分取 HPLC (日本分析工業 LC-9110)		※	1／時間

※ 自己測定あるいは依頼測定を受付けない